

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNINA9910711207403321 |
| Autore | Randa James |
| Titolo | Noise temperature measurements on wafer // James. Randa |
| Pubbl/distr/stampa | Gaithersburg, MD : , : U.S. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology, , 1997 |
| Descrizione fisica | 1 online resource |
| Collana | NIST technical note ; ; 1390 |
| Altri autori (Persone) | RandaJames |
| Soggetti | Electronic noise - Measurement |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Note generali | 1997. Contributed record: Metadata reviewed, not verified. Some fields updated by batch processes. Title from PDF title page. |
| Nota di bibliografia | Includes bibliographical references. |